A. Němejcová-Kochanovská Vliv nedokonalé štěpnosti na přesnost měření ve spektroskopii paprsků X

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 67 (1938), No. 4, 288--300

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/122007

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1938

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* http://project.dml.cz

Vliv nedokonalé štěpnosti na přesnost měření ve spektroskopii paprsků X.

A. Němejcová-Kochanovská, Praha.

(Došlo 6. května 1938.)

U některých krystalů vyznačujících se velkou reflekční mohutností paprsků X, na př. u sfaleritu, nesouhlasí přirozená povrchová plocha krystalu s rovinou Braggovy reflexe. Tento případ je analogií krystalů s plochou uměle sbroušenou. Byly odvozeny podmínky reflexe na takových krystalech a udána metoda, kterou lze i takových krystalů použíti k přesnému měření.

Poukazuje se na možnost výskytu reflexí na jiných krystalografických plochách než na rovinách štěpných. Tyto reflexe mohou vésti k omylu při spektrální analyse zvláště při použití velmi světelných metod, na př. fokusačních.

Hodnocení krystalů při jejich použití jako mřížek ve spektroskopii paprsků X nebylo dosud dobře možné, neboť výsledky získané s nimi různými autory vedou k protichůdným závěrům. Tak na př. za nevhodné byly označovány i t. zv. mosaikové krystaly.

Lze to říci zvláště o krystalech dvou nerostů s velkou reflekční mohutností, a to o krystalech kamenné soli (NaCl) a o krystalech sfaleritu (ZnS). O krystalech kamenné soli je známo, že mají asi 19-29násobnou reflekční mohutnost než jaká plyne z teorie reflexe pro dokonalé krystaly¹) (totéž platí i o krystalu ferrocyanidu, který používal Moseley²). Tyto krystaly kamenné soli, které byly s počátku používány ve spektroskopii paprsků X jako normály s mřížkovou konstantou $\hat{d} = 2,81400$ Å, byly později opuštěny jako krystaly nehodící se k přesnému měření.

Vysokou reflekční mohutnost mají rovněž krystaly sfaleritu, jak ukázali Dolejšek a Engelmannová ve své práci o jiskrových liniích v K-serii.³) Rovněž Faessler a Küpferle,⁴) kteří srovnávali

- Bragg, James, Besanquet, Phil. Mag., 41 (1921), 309; 42 (1921), 1.
 Moseley, Phil. Mag., 26 (1931), 300.
 Dolejšek-Engelmannová, C. R., Séance du 21. janvier (1929).
 Faessler, Küpferle, ZS f. Phys., 8 (1935), 237.

reflekční mohutnost krystalů různých nerostů, nalezli pro sfalerit velmi výhodnou reflexi. Jak ukázali Feifer a Ježek.⁵) sfalerit má ještě větší mosaikovou strukturu než kamenná sůl podle měření Kirkpatricka a Rosse.⁶)

Vysoká reflekční mohutnost krystalů kamenné soli a sfaleritu je způsobena, jak ukázali Dolejšek, Jahoda, Ježek a Rozsíval⁷) tím, že tyto krystaly mají značnou pravidelnou mosaiku, jejíž velikost w_{σ} zvyšuje koeficient reflexe jednotlivých "singlekrystalů", který plyne z Darwinovy teorie disperse a označuje se r_c , takže celkový koeficient reflexe mosaikového krystalu je pak $R=r_{c}.w_{\sigma}.$

Je tedy užití mosaikových krystalů výhodné pro jejich velkou reflekční mohutnost, neboť s druhé strany, jak ukázal Bačkovský,⁸) lze v symetrickém uspořádání užitím mosaikových krystalů docíliti rozlišovací mohutnosti stejně velké jako krystaly dokonalými. Příklad docílení značné rozlišovací mohutnosti na krystalu kamenné soli (dokonce plasticky deformované) podali Dolejšek a Bačkovský.⁹)

Z těchto výsledků je zřejmo, že lze za určitých podmínek dokonce výhodně použíti pro přesná měření řadu krystalů, které, protože nebyly pokládány za ideálně dokonalé, nebyly dosud ve spektroskopii paprsků X používány.

U takových krystalů, na př. u sfaleritu, je ovšem nutno, má-li jich býti použito k přesnému měření, překonati určité obtíže vznikající nedokonalou štěpností. Následkem nedokonalé štěpnosti (která podmiňuje povrchovou mosaiku), nesouhlasí u takových krystalů někdy povrchová plocha s rovinou Braggovy reflexe. Případ je stejný jako u krystalů s povrchovou plochou opticky zdokonalenou (zbroušenou, leštěnou). Platí tedy všechny úvahy v následujícím uvedené pro krystaly nedokonale štěpné stejně, jako pro krystały s plochou uměle zdokonalenou.

Následkem nedokonalé štěpnosti nevznikne při štípnutí nerostu dokonalá plocha, nýbrž krystal se štípe schodovitě (tyto schůdky jsou ovšem málokdy tak velké, aby byly patrné), takže vzniklá povrchová plocha nesouhlasí s rovinou Braggovy reflexe. Ve velmi značné míře jsme pozorovali tento zjev u sfaleritu (ZnS), ale jak ukazuje práce Manningova,10) není vyloučeno tvoření takových schůdků ani u krystalu vápence, který patří mezi nerosty velmi dokonale štěpné.

7) V tisku.

⁵⁾ V tisku.

⁸) Kirkpatrick, Ross, Phys. Rev., 43 (1933), 596.

 ^a) Bačkovský, Nature, 5 (1938).
 ^a) Dolejšek, Bačkovský, Čas. pro pěst. mat. a fys., 67 (1938), 211.
 ^a) Manning, Review of Sc. Instr., 5 (1934), 316.

Velikosti chyb při takových nedokonalých krystalech závisí na velikosti odklonu plochy vzniklé nedokonalým štěpením od rovin Braggovy reflexe. Odchylky v polohách čar, jež nevznikají těmito vadami krystalů, jsou podstatně jiné, než ty, jež vznikají nesprávnou justací přirozené roviny dokonale štěpných krystalů do osy spektrografu. Při přesném měření čar ve spektrech paprsků X, při němž je na př. vyžadována přesnost taková, jako při převodu X-jedniček na absolutní škálu (na př. při měření náboje elektronu z mřížek krystalů) mohou tyto odchylky již značně zkresliti výsledek a jsou značné důležitosti. Kromě toho lze očekávati, že tyto vady krystalu budou míti vliv i na intensitu reflexe.

Nejdříve odvodíme matematické vztahy pro reflexi na takových nedokonalých krystalech, u nichž povrchová rovina svírá s rovinou Braggovy reflexe úhel γ , příslušné posuvy čar a velikosti



chyb v určení mřížkové konstanty.

Předpokládejme ideální rovinný svazek rovnoběžných paprsků. Soustavu souřadnou volme takto: Rovinu dopadajícího

svazku paprsků volme za rovinu z = 0. Paprsek jdoucí středem lineární štěrbiny s_0 volme za osu y. Počátek O v průsečíku s_0 a povrchové plochy krystalu. Osu x totožnou

s osou spektrografu, ležící v povrchové ploše krystalu (viz obr. 1).

Kdyby povrchová plocha krystalu byla totožná, resp. rovnoběžná s rovinami Braggovy reflexe, zůstával by paprsek s_0 i po reflexi v rovině x = 0 a svíral by s dopadajícím paprskem s_0 úhel 180 — 2φ . Ostatní paprsky svazku by rovněž zůstaly v rovinách rovnoběžných s rovinou x = 0 a svíraly by s příslušnými dopadajícími paprsky úhel 180 — 2φ . Poněvadž v našem případě roviny Braggovy reflexe nějsou totožné s povrchovou plochou krystalu, nýbrž svírají s ní úhel γ a jejich průsečnice s povrchovou plochou krystalu svírají s osou x úhel β , nezůstane paprsek s_0 obecně po reflexi v rovině x = 0. Paprsek reflektovaný a dopadající budou ležet v rovině určené paprskem dopadu a kolmicí v bodě dopadu O (počátku) k rovině Braggovy reflexe, kterážto kolmice není v tomto př. totožná s kolmicí v bodě dopadu O k povrchové ploše krystalu. Při tom opět paprsek reflektovaný s'₀ bude

290

A

svírati s paprskem dopadajícím s_0 úhel 180 — 2φ , ale v rovině, která není totožná s rovinou x = 0.

Polohu reflektovaného paprsku s_0' určíme jednak úhlem 180 — $2\varphi'$, který svírá jeho průmět s_0' do roviny x = 0 s paprskem dopadajícím s_0 a jednak souřadnicí x průsečíku reflektovaného paprsku s'o s fotografickým filmem, upraveným po obvodu spektrografu o poloměru r.

Kdyby se jednalo jen o nesprávnou justaci dokonalé reflexní plochy do osy spektrografu, nenastávala by reflexe všech paprsků uvažovaného svazku v bodech osy spektrografu a obraz čáry na filmu (část kuželosečky) by nebyl rovnoběžný s osou spektrografu. Naproti tomu v uvažovaném případě, poněvadž reflexe všech paprsků svazku nastává (na rozdíl od chybné justace) v bodech krystalu ležících na ose spektrografu, zůstane i obraz vzniklé čáry (části přímky) rovnoběžný s osou spektrografu, která je totožná s osou x. Následkem toho úhel, který čára svírá se stopou primárního svazku, bude $2\varphi'$ a nikoli 2φ . Rovněž při proměřování čar budou se uplatňovati úhly φ' a nikoli φ .*)

Uhel reflektovaných paprsků a souřadnici x průsečíku reflektovaného paprsku s'o určíme následujícím postupem: Dopadají-li paprsky s na povrchovou plochu krystalu procházející osou spektrografu pod úhlem α , je rovnice povrchové plochy v soustavě souřadné volené shora uvedeným způsobem:

$$y\sin\alpha + z\cos\alpha = 0. \tag{1}$$

Roviny Braggovy reflexe nechť svírají s povrchovou rovinou krystalu úhel γ a krystal nechť je stočen tak, že směr jejich průsečnic s povrchovou plochou krystalu svírá s osou x úhel β (viz obr. 1).

Pak rovnice roviny Braggovy reflexe jdoucí počátkem má tvar:

 $-x\sin\beta\sin\gamma + y(\cos\gamma\sin\alpha - \cos\alpha\sin\gamma\cos\beta) +$

 $+ z (\cos \alpha \cos \gamma + \sin \alpha \sin \gamma \cos \beta) = 0.$ (2)

Paprsek s_0 totožný s osou y svírá tudíž s touto Braggovou rovinou úhel ω , pro který platí:

 $\sin \omega = \cos \gamma \sin \alpha - \cos \alpha \sin \gamma \cos \beta.$

Má-li nastati reflexe, musí se ω rovnati úhlu φ určenému z Braggovy rovnice, čili úhel α musí býti volen tak, aby platilo:

> $\sin \varphi = \cos \gamma \sin \alpha - \cos \alpha \sin \gamma \cos \beta.$ (3)

^{*)} Při této úvaze nebylo respektováno vnikání paprsků do krystalu. Lze však snadno nahlédnouti, že vnikáním paprsků do krystalu se na předchozích úvahách v podstatě mění jen to, že nastane rozšíření čáry směrem ke kratším vlnovým délkám.

Rovnice roviny reflektovaného paprsku s'o a dopadajícího paprsku s_0 je určena dopadajícím paprskem s_0 totožným s osou y a kolmicí v bodě dopadu k rovině Braggovy reflexe (2):

$$x (\cos \alpha \cos \gamma + \sin \alpha \sin \gamma \cos \beta) + z \sin \beta \sin \gamma = 0.$$
 (4)

Tato rovina svírá s rovinou x = 0 úhel η daný následujícím výrazem:

$$\cos \eta = \frac{\cos \alpha \cos \gamma + \sin \alpha \sin \gamma \cos \beta}{\sqrt{(\cos \alpha \cos \gamma + \sin \alpha \sin \gamma \cos \beta)^2 + \sin^2 \beta \sin^2 \gamma}}$$

Paprsek reflektovaný s'_{0} svírá s paprskem dopadajícím s_{0} úhel $1\overline{80} - 2\varphi$ (kde φ je Braggův úhel). Při měření polohy čáry se neměří však v tomto případě úhel 180 — 2 φ , nýbrž průmět tohoto úhlu do roviny x = 0, pro který platí vztah:

tg
$$(180 - 2\varphi') = \cos \eta$$
 tg $(180 - 2\varphi)$, je-li $(180 - 2\varphi) < 90^{\circ}$,
tg $2\varphi' = \cos \eta$ tg 2φ , je-li $(180 - 2\varphi) > 90^{\circ}$. (5)

Při stejném γ bude míti úchylka φ' od φ maximální hodnotu pro $\beta = 90, 270^{\circ}. \varphi'$ bude rovno φ pro $\beta = 0, 180^{\circ}.$ Existují tedy pro každý krystal dvě charakteristické polohy, ve kterých nenastává posuv čáry.

Průsek reflektovaného paprsku s filmem se posune nad nebo pod rovinu x = 0 o délku:

$$x = \frac{r \sin 2\varphi \sin \eta}{\sqrt{\cos^2 2\varphi + \cos^2 \eta \sin^2 2\varphi}}.$$
 (6)

kde r je poloměr spektrografu.

Jak patrno z uvedeného vzorce, x má maximální hodnotu při témž γ pro $\beta = 90$, 270°. Je rovno 0 pro $\beta = 0$, 180°, což jsou obě již zmíněné charakteristické polohy. V dalším uvidíme, že tyto polohy jsou také charakteristické pro intensitu reflexe.

V následující tabulce jsou uvedeny číselně maximální velikosti chyb Δd v určení mřížkové konstanty krystalu sfaleritu pro $\gamma = 1^{\circ}$ a $\gamma = 30'$ při poloze $\beta = 90, 270^{\circ}$. Mřížková konstanta je určena z druhého a čtvrtého řádu Cu $K\alpha_{12}$, jednak metodou φ

·Y	φ'	d	Δd	$d_{\rm II, \ IV}$	Δd
1°	$\begin{cases} 23^\circ \ 42' & 5,5'' \\ 53^\circ \ 31' \ 11,5'' \end{cases}$	3,82439 3,82384	$\left \begin{array}{c}+0,39\\-0,16\end{array}\right $	3,82355	-0,45
30'	$\begin{cases} 23^{\circ} \ 42' \ 12,5'' \\ 53^{\circ} \ 31' \ 00,0'' \end{cases}$	3,82410 3,82399	$ +0,10 \\ -0,01$	3,82393	

Tabulka č. 1.

a jednak metodou z. Při tom za správnou je vzata pro mřížkovou konstantu hodnota d = 3,82400 Å, pro vlnovou délku Cu $K\alpha_1 =$ = 1537,30 X. J.; z těchto hodnot vychází $\varphi_{II} = 23^{\circ} 42' 15''$ a $\varphi_{\rm IV} = 53^{\circ} \, 30' \, 59''$.

Z uvedené tabulky je viděti, že chyby, kterých se můžeme dopustiti v určení mřížkové konstanty u takových vadných krystalů, sahají až do desetin X. J. Dále je viděti, že metoda z neskýtá v tomto případě žádné výhody oproti metodě φ . Proto nelze v těchto případech také použíti korekční metody navržené Inanandou¹¹) pro přesný výpočet mřížkové konstanty, neboť jeho metoda se zakládá právě na tom, že veškeré justační chyby se mnohem méně projeví v metodě \varkappa než v metodě φ , což v námi uvažovaném případě neplatí.

Jak patrno z uvedeného závisí posuvy čar a z nich plynoucí chyby při přesném určení mřížkové konstanty nejen na velikosti odklonu povrchové roviny od roviny Braggovy reflexe (γ), nýbrž u jednoho a téhož krystalu také na orientaci průsečnic rovin Braggovy reflexe s povrchovou rovinou vůči ose spektrografu (β). Pro každý krystal existují však dvě polohy ($\beta = 0, 180^{\circ}$), ve kterých nenastane žádný posuv reflektované čáry, způsobený ve všech



Obr. 2.

ostatních polohách odchvlkou ro-

Obr. 3.

293

Pokud se týče intensit čar reflektovaných uměle zbroušenými nebo nedokonale štěpnými plochami, lze očekávati, že nebude lhostejno, jak při témž úhlu dopadu takovou plochu orientujeme vůči dopadajícímu svazku paprsků, neboť reflektovaný paprsek probíhá různě dlouhou dráhu prostředím krystalu. Největší případně nejmenší intensitu lze očekávati tehdy, jsou-li průsečnice, rovin Braggovy reflexe s povrchovou rovinou krystalu rovnoběžné s osou spektrografu (příp. s průsečnicí rovinného svazku paprsků s povrchovou plochou krystalu) a svírá-li rovina dopadajících paprsků s povrchovou rovinou krystalu úhel $\alpha = \varphi - \gamma$ (obr. 2,

¹¹) Inananda, Inaugural Dissertation, Spectroscopic Inst. Charles University, Čas. pro pěst. mat. a fys. 65 (1936), 33.

reflektovaný paprsek probíhá nejkratší dráhu prostředím krystalu), resp. $\alpha = \varphi + \gamma$ (obr. 3, reflektovaný paprsek probíhá nejdelší dráhu prostředím krystalu). Bude se tedy intensita reflektovaného záření při otáčení krystalem kol osy kolmé k ose spektrografu a k povrchové ploše krystalu během otáčení o úhel 360° měniti a nabývati jednoho maxima a jednoho minima navzájem o 180° vzdálených. Při tom ovšem předpokládáme, že současně měníme 'příslušně i úhel dopadu α (podle vzorce 3), který také nabývá jednoho maxima $\alpha = \varphi + \gamma$ a jednoho minima $\alpha = \varphi - \gamma$.

Při použití takových krystalů k přesnému měření lze tudíž vyloučiti zmíněné chyby tím, že takový vadný krystal orientujeme vůči ose spektrografu do polohy znázorněné v obr. 2, t. j. tak, aby průsečnice rovin Braggovy reflexe s povrchovou rovinou krystalu byly rovnoběžné s osou spektrografu. Při poloze v obr. 3 jsou sice také vyloučeny úchylky čar vzniklé z nesouhlasu povrchové roviny s rovinou Braggovy reflexe, nastávají však značné úchylky čar zvětšeným lomem.¹²)

Stanoviti obě charakteristické polohy krystalu lze dosti přesně tím způsobem, že krystalem otáčíme kolem osy kolmé k ose spektrografu a k povrchové rovině a při tom měříme úhly dopadu α pro některou čáru. Tyto úhly se u vadných krystalů mění s úhlem otočení podle již uvedeného vzorce (3), nabývajíce jednou hodnoty maximální $\alpha = \varphi + \gamma$ pro $\beta = 0$ a jednou hodnoty minimální $\alpha = \varphi - \gamma$ pro $\beta = 180^{\circ}$. Tyto dvě význačné polohy jsou právě polohy hledané. Která z obou nalezených poloh se hodí k přesnému měření, rozhodne se podle intensity reflexe.

Takové odchylky rovin Braggovy reflexe jsme zjistili ve značné míře u sfaleritu (až 3°) při podrobném studiu reflekčních vlastností některých krystalů sfaleritu s přirozenou plochou a některých krystalů téhož nerostu, které pro makroskopickou nedokonalost přirozené plochy byly uměle přibroušeny a vyleštěny.

Za tím účelem jsme provedli takovou úpravu, aby krystal bylo možno otáčeti také kol osy kolmé k ose spektrografu a k povrchové ploše krystalu. Krystal byl najustován svou povrchovou plochou do osy spektrografu, takže poloha odštípnuté plochy zůstávala při otáčení kol osy kolmé k ose spektrografu a k povrchové ploše krystalu vůči dopadajícímu svazku paprsků neproměnná. Ukázalo se, že jestliže rovina Braggovy reflexe nesouhlasila s povrchovou plochou krystalu, tu, ačkoliv tato zůstávala při otáčení kol osy kolmé k ose spektrografu a k povrchové rovině krystalu neproměnná, nezůstával Braggův úhel sklonu φ konstantní. Následkem toho, že v různých polohách krystalu při otáčení kol osy kolmé k ose spektrografu a k povrchové ploše krystalu neodpovídá úheľ dopadu α skutečnému Braggovu úhlu φ , mění se při otáčení

¹²) Davis, Nardroff, Phys. Rev., 23 (1924), 291.

si ,

kol této osy při konstantním úhlu dopadu α intensita čáry. Jak dalece to závisí na úhlu β , je patrno z obr. 4 a 5. V obr. č. 4 jsou reprodukovány snímky druhého řádu dubletu Cu $K\alpha_1\alpha_2$ na sfaleritu, který byl zmíněným způsobem otáčen kol osy kolmé k ose



Obr. 4.

Ubývání intensit reflexí dubletu Cu $K\alpha_1\alpha_2$ na nedokonalém krystalu sfaleritu ($\gamma = 3^{\circ}$) při konstantním úhlu dopadu a měnícím se nastavení krystalu kol osy kolmé k ose spektrografu a povrchové rovině krystalu.

spektrografu a k povrchové ploše krystalu postupně vždy o 2,5°, při čemž byl současně vždy poněkud posunut film tak, aby se jednotlivé obrazy čar nepřekrývaly. Z jednotlivých snímků označených 1—7 je viděti značné postupné ubývání intensity, takže v poloze 7, která odpovídá otočení krystalu o = 17,5° obraz dubletu takřka mizí. Snímek 8 je opět návrat do původní polohy

pro kontrolu, zda se intensita záření nezměnila a odpovídá snímku 1. Ovšem uvedená změna intensity (resp. změna Braggova úhlu φ) odpovídá velmi značné úchylce rovin Braggovy reflexe od povrchové plochy krystalu, $\gamma = 3^{\circ}$. Naproti tomu na obr. č. 5, kde jsoureprodukovány snímky reflektovaného duble-



Obr. 5.

Reflexe dubletu Cu $K\alpha_1\alpha_2$ na dokonalém krystalu kalcitu při konstantním úhlu dopadu a měnícím se nastavení kol osy kolmé k ose spektrografu a povrchové ploše krystalu.

tu Cu $K\alpha_1\alpha_2$ na přirozené štěpné ploše velmi dokonalého krystalu vápence, není v celém rozmezí otočení $\beta = 0 - 360^{\circ}$ patrno žádné ubývání intensity (změna Braggova úhlu sklonu).

V obr. 6 jsou reprodukovány snímky čar opět pro zmíněný krystal sfaleritu pro obě polohy charakterisované úhlem dopadu $\alpha = \varphi + \gamma$ (a) a $\alpha = \varphi - \gamma$ (b). Ve shodě s tím, co bylo výše

Obr. 6.

Intensity reflexí dubletu Cu $K\alpha_{12}$ na krystalu sfaleritu ($\gamma = 3^{\circ}$) v obou charakteristických nastaveních krystalu.

krystalu než ve druhém. Že se nejedná v tomto případě o chybnou justaci do osy spektrografu, dokazují snímky v obr. 7. Jsou to opět reflexe dubletu Cu $K\alpha_1\alpha_2$ na sfaleritu ve dvou polohách odchýlených od obě polohy, ve kterých svírají průsečnice

uvedeno, je jasně patrna odlišná intensita u obou snímků. V tomto případě, na rozdíl od předchozího, je však změna intensity způsobena tím, že v jedné poloze krystalu probíhá reflektovaný paprsek delší dráhu v prostředí

obou charakteristických poloh o 90°, takže navzájem jsou opět vzdáleny o 180°. Jsou to obě polohy, ve kterých svírají průsečnice rovin Braggovy reflexe a povrchové plochy krystalu s osou spektrografu úhel 90°. V těchto polohách jsou chyby při přesném určení mřížkové konstanty největší. Snímek *a* představuje reflexi v jedné z těchto poloh, snímek *b* ve druhé poloze (při posunutí filmem) a snímek *c* reflexi *a* i *b* současně při nepohnutém filmu. Při tom byla z krystalu nehybnou clonkou vymezena vždy stejně velká reflekční plocha. Jak patrno ze snímku *c* oba obrazy se dokonale kryjí, takže se nemůže jednati o chybnou justaci do osy (v případě chybné justace by se oba obrazy dubletu křížily). Obrazy dubletu se v obou případech navzájem vertikálně (ve směru osy spektrografu) posunou, jak je rovněž dobře patrno z reprodukcí snímků *a* i *b*. Ve směru kratších vlnových délek se sice také posunou, ale tento posuv je pro obě polohy stejně velký a ve stejném smyslu.

Podrobným experimentálním propracováním nalezených podmínek pro přesné měření mřížkové konstanty takových krystalů se zabývá R. Faus na krystalu kamenné soli, který docílil přesnosti úhlového odečtení 0,1 vteřiny, takže bude moci spolehlivě verifikovati i nepatrné odklony Braggových reflekčních rovin od povrchové plochy krystalu.

Při fokusačních metodách a při analyse nejedná se zase ani tak o posuvy čar jako o vznik "nedovolených reflexí", které mohou vésti k mylným závěrům.

Je na snadě, že při větších odklonech povrchové plochy krystalu od Braggovy reflekční plochy se mohou objeviti za určitých postavení krystalu reflexe paprsků X také od jiných krystalografických ploch než roviny štěpné. Tak na př. za určitých postavení krystalu sfaleritu najustovaného do osy plochou (110) lze obdržeti reflexe od plochy (111). Tyto plochy svírají navzájem



Obr. 7.

Reflexe dubletu Cu $K\alpha_1\alpha_2$ na krystalu sfaleritu ($\gamma = 3^{\circ}$) ve dvou různých nastaveních $\beta = 90^{\circ}$ a $\beta^{\circ} = 270^{\circ}$.

úhel 35° 16′, při čemž jak známo, plocha (110) dává jen reflexe sudých řádů, kdežto plocha (111) dává reflexe všechny. Tento případ je analogií svrchu uvedeného případu pro velká γ .

V těchto případech se reflexe od plochy (111) objeví za určitého postavení kol osy spektrografu a za určitého postavení kol osy kolmé k ose spektrografu a povrchové rovině krystalu, při nichž je právě splněna pro dopadající paprsky a plochu (111) Braggova podmínka. Čáry takto vzniklé jsou pak ovšem skutečné a mohou vésti k záměně při identifikaci jednotlivých čar. Rovněž posuvy čar v tomto případě velkého γ jsou daleko větší, jak je zřejmo

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. 16

z obr. 8, kde jsou reprodukovány snímky reflexe dubletu Cu $K\alpha_1\alpha_2$ v prvním řádu na ploše (111). V obr. 8 jsou reprodukovány 3 polohy tohoto dubletu při konstantním úhlu dopadu α a třech různých nastaveních kol osy kolmé k ose spektrografu a k povrchové ploše krystalu.



Obr. 8.

Obr. 9.

Obr. 8. Posuv dubletu Cu $K\alpha_1\alpha_2$ reflektovaného na ploše (111)] sfaleritu při třech různých nastaveních krystalu.

Obr. 9. Různý charakter reflexí dubletu Cu $K\alpha_1\alpha_2$ v I. a III. řádu na ploše (111) vadného krystalu sfaleritu při různých nastaveních krystalu.

Tyto reflexe mohou míti vzhled zcela normálních ostře definovaných čar, jako v obr. 9a, který představuje také reflexi prvního řádu dubletu Cu $K\alpha_1\alpha_2$ od této plochy, ale při jiném nastavení krystalu, nebo v obr. 9b, kde je reprodukován snímek třetího řádu také na ploše (111).

V jiných polohách naopak ztrácejí tyto reflexe charakter čar a podobají se "duchům" vyskytujícím se u optických spekter, jak patrno z obr. 9c a 9b, na nichž je reprodukováno několik snímků prvního řádu dubletu Cu $K\alpha_1\alpha_2$ na ploše (111) v jiných nastaveních

krystalu. Takové stopy na filmu mohou vésti k omylu, že se jedná o vady krystalu, lze je však příslušným stočením kol osy kolmé k ose spektrografu a povrchové ploše krystalu vymýtiti.

Tyto zjevy, později zmíněné, nemají sice významu při přesném měření, mají však význam při chemické analyse nebo při hledání nových čar, kdy se pracuje s krystaly otáčenými kol osy spektrografu ve velkém rozmezí, ježto lze pak očekávati výskyt takových "nedovolených reflexí" u většiny krystalů.

Z uvedeného je patrno, že lze krystalů nedokonale štěpných nerostů, které se obvykle vyznačují velkou reflekční intensitou vyvolanou silnou mosaikou, nebo krystalů uměle zbroušených a leštěných použíti stejně dobře k přesnému měření jako krystalů dokonalých za předpokladu, že tyto krystaly vhodně orientujeme. Rovněž výskytu "nedovolených reflexí", které mohou vaditi při fokusačních metodách a při analyse, lze zabrániti vhodnou orientaci krystalu.

Na konci práce vzdávám uctivý dík p. prof. dr. V. Dolejškovi za cenné pokyny a informace a p. prof. dr. F. Ulrichovi za ověření odchylek povrchových rovin krystalů sfaleritu přímým proměřením krystalografických úhlů příslušných exemplářů krystalů.

Spektroskopický ústav Karlovy university.

The influence of imperfect cleavability of crystals on the accuracy of measurements in the X-rays spectroscopy.

(Abstract of the preceding paper.)

Owing to an imperfect cleavability, crystals of some minerals are split step-like (microscopically). This causes a non-conformity between the surface plane of the crystal adjusted in the axis of the spectrograph and the plane of Bragg's reflection. These crystals behave in an analogical way to those artificially ground. Considerable deviations of this kind of the Bragg's reflecting planes from the natural surface plane of crystal were ascertained by us in the case of sphallerite (ZnS) which possesses a considerable reflecting power and which owing to its small lattice constant is very advantageous for X-spectroscopy.

In consequence of the non-conformity of the surface plane of the crystal (which is adjusted into the axis of spectrograph) with the plane of Bragg's reflections, a displacement of the lines takes place when such crystals are used for the most accurate measurements in the X-spectroscopy. In this case, however, the image of the reflected lines stay parallel one to another and also to the axis of the spectrograph (in contradistinction to cases of erroneous

16*

م. ایکست امیر اینان

adjustement). The displacement of lines effected by this imperfection of crystals can have a considerable influence in the exact determination of the lattice constant; nevertheless these displacements can be eliminated if the crystal is oriented so that the line of intersection of both planes, i. e. that of Bragg's reflections and that of the crystal surface is parallel to the axis of the spectrograph. Each crystal has two such characteristic positions. One is marked out by the maximum, the other by the minimum intensity of the reflection. This is due to the fact that in former case the reflected beam travels through the minimum path, while in the later case through the maximum path in the crystal medium. Though both of the characteristic positions exclude the displacements of lines described above, it is but the position characterized by the maximum intensity which is suitable for accurate measurements. This fact is due not only to the larger intensity of reflection but also to the reason that the reflected beam is in this position less deviated by refraction than in the other case.

Using such crystals there appear very often reflections comming from other crystallographic planes than from the scissible ones. These reflections can have the appearance of "spirits" similar to those obtained with optical gratings but they can have also the appearance of normal sharply defined lines which often lead to an error in spectral analysis, especially when very lumineous methods like for instance focussing methods are used. However, these lines can be easily eliminated by a suitable turn of the crystal around the axis perpendicular to the surface plane of crystal and to the axis of the spectrograph.